

# パワーデバイスと実装の故障解析への ロックインサーモグラフィの応用

吉井 一郎 \*

**Applications of IR Lock-in Thermography to Failure Analysis for Power Device and Assembly**

Ichiro YOSHII\*

---

\*DCG システムズ合同会社 (〒 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-8-8 日総第 16 ビル)

\*DCG Systems G.K. (Nisso 16 Bldg, 3-8-8, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 222-0033)